Анализ структуры композитных металл-диэлектрических материалов методом малоуглового рентгеновского рассеяния

© И.В. Рожанский, Д.А. Закгейм, Т.Н. Василевская*, С.А. Гуревич

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия * Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук, 199155 Санкт-Петербург, Россия E-mail: igor@quantum.ioffe.rssi.ru

(Поступила в Редакцию 5 октября 2000 г.)

Методом малоуглового рентгеновского рассеяния исследовалась структура композитных пленок Cu:SiO₂, полученных с использованием технологии одновременного магнетронного напыления. Экспериментальные спектры анализируются на основе прямого численного моделирования рассеяния на полидисперсной системе сферических частиц с высокой объемной концентрацией. В предположении "log-нормального" распределения частиц по размерам получено хорошее совпадение расчетных спектров рассеяния с экспериментальными и определены параметры этого распределения.

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (грант № 98-02-18210) и программой "Физика твердотельных наноструктур" МН РФ (гранты № 97-2014 и 97-1035).

В последнее время значительно возрос интерес к исследованию композитных материалов (нанокомпозитов), т. е. структур, содержащих металлические гранулы нанометрового размера, случайным образом распределенные в диэлектрической матрице [1]. При таких размерах металлических частиц электростатическая энергия зарядки их одним электроном E_c будет составлять сотни meV, а это означает, что при температурах вплоть до комнатной в подобных структурах могут наблюдаться эффекты макроскопического квантования заряда [2]. Этот факт делает нанокомпозиты весьма перспективными материалами для создания новых приборов наноэлектроники [3].

Наиболее распространенным методом получения композитных материалов является одновременное магнетронное напыление из двух источников [1]. Металлические гранулы в этих материалах образуются в результате фазового распада пересыщенного твердого раствора металла в диэлектрике [4]. Поскольку образование гранул в композитном материале регулируется статистическими процессами, имеется некоторое распределение гранул по размерам. Это распределение является важной структурной характеристикой, которую необходимо знать для проведения теоретического анализа электрических свойств композитных материалов [5]. Исследования структуры композитных материалов методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) показывают, что металлические гранулы имеют преимущественно сферическую форму, а также позволяют оценить их характерный размер. Тем не менее до сих пор не существует надежного метода для получения детальной информации о распределении гранул по размерам.

В настоящей работе для изучения характера распределения гранул по размерам структура композитного материала исследовалась методом малоуглового рентгеновского рассеяния. Рассеяние рентгеновских лучей под малыми углами (РМУ) — дифракционный метод, который широко используется для изучения надатомной структуры вещества. Важнейшее достоинство метода РМУ состоит в том, что он позволяет анализировать структуру разупорядоченных систем [6]. Для систем с низкой концентрацией рассеивающих центров сферической формы распределение частиц по размерам на основе спектра РМУ может быть получено в явном виде [7], однако исследуемый материал характеризуется высокой (28 vol.%) концентрацией металлических частиц. В рассеянии на таких структурах важную роль играют эффекты межчастичной интерференции. В этом случае задачу нахождения распределения частиц по размерам невозможно решить в явном виде. Для концентрированных систем сферических частиц анализ данных рассеяния проводят обычно либо на основе приближения Перкуса-Йевика, учитывающего влияние межчастичной интерференции [8], либо с помошью прямого численного моделирования рассеяния. Использование численного моделирования для анализа рассеяния на концентрированных системах, на наш взгляд, носит более универсальный характер, в то время как приближение Перкуса-Йевика обладает определенной погрешностью, которая растет с увеличением концентрации [9].

В данной работе анализ экспериментальных данных РМУ с помощью численного моделирования рассеяния на композитном материале позволил с хорошей точностью определить распределение гранул по размерам. Также показано влияние ширины распределения по размерам и концентрации металлической фазы на вид спектра РМУ.

В работе исследовались композитные металл-диэлектрические пленки, полученные методом одновременного магнетронного напыления металла и диэлектрика на вращающуюся кремниевую подложку, при этом в качестве металла использовалась медь, а в качестве диэлектрика — аморфный SiO₂. Приготовление пленок осуществлялось на установке магнетронного напыления SCM-450 (Alcatel, Франция) в атмосфере аргона при вращении подложек над источниками Си и SiO₂. Скорости напыления подбирались таким образом, чтобы за один проход над источниками на подложку осаждалось менее одного монослоя материала. Таким методом были получены композитные металл-диэлектрические пленки Cu:SiO₂ толщиной 200 nm с концентрацией меди 28 vol.%. В работе [10] приведено подробное описание технологического процесса. На рис. 1 приведена микрофотография участка пленки, полученная с помощью просвечивающего электронного микроскопа. Видно, что получаемый материал представляет собой аморфную матрицу, в которой присутствуют расположенные неупорядоченно металлические кластеры сферической формы (гранулы), средний размер которых составляет порядка 3 nm. Однако построить функцию распределения частиц по размерам с помощью такой фотографии весьма трудно, поскольку изображения отдельных гранул сильно перекрываются из-за высокой плотности.

Структура полученных пленок Cu: SiO₂ исследовалась также методом рентгеновской дифрактометрии. На обзорном спектре рентгеновской дифракции наблюдались пики, соответствующие отражению от плоскостей (111) (угол отражения $2\theta = 43.3^{\circ}$) и (200) (угол отражения $2\theta = 50.5^{\circ}$) кристаллической решетки меди. Наличие этих пиков однозначно свидетельствует о том, что в исследованной композитной пленке металлические гранулы имеют кристаллическую структуру, характерную для объемной меди.



Рис. 1. ПЭМ композитной пленки.

2. Анализ спектров РМУ композитных пленок

Исследование малоуглового рентгеновского рассеяния проводилось с использованием линии излучения CuK_{α} ($\lambda = 1.54$ Å). Экспериментальные кривые получены при использовании рентгеновской установки с коллиматором системы Кратки. Введены коллимационные поправки на высоту и ширину пучка. Измерения интенсивности РМУ осуществлялись с точностью $\pm 1\%$. Геометрические размеры рентгеновского пучка составляли 0.1×12 mm. Подробное описание методики измерения приведено в [11]. Экспериментальный спектр РМУ изображен на рис. 2 (точки).



Рис. 2. Экспериментальный спектр РМУ (точки) и результат моделирования (сплошная линия). На вставке — распределение гранул по радиусам.

В общем случае выражение для интенсивности рассеяния дается известной формулой Цернике–Принса [12]

$$I(\mathbf{s}) = NF^2(\mathbf{s})S(\mathbf{s}),\tag{1}$$

где s — вектор рассеяния, его модуль $s = 4\pi/\lambda \sin \Theta$, 2Θ — угол рассеяния, F(s) — усредненный формфактор рассеивающих частиц, зависящий только от их формы и собственных размеров, S(s) — структурный фактор, зависящий от взаимного расположения частиц, N — число частиц в системе.

Для полидисперсной системы частиц одинаковой формы с распределением по размерам D(r)

$$F(\mathbf{s}) = \int f(\mathbf{s}, r) D(r) dr, \qquad (2)$$

где для шара радиусом r формфактор есть [6]

$$f(s,r) = \frac{4}{3}\pi r^3 \cdot 3\frac{\sin sr - sr\cos sr}{(sr)^3}.$$
 (3)

Как видно из (3), в выражение для формфактора размер частицы входит только в виде безразмерного произведе-

ния sr. Структурный фактор $S(\mathbf{s})$ есть

$$S(\mathbf{s}) = \frac{1}{N} \sum_{j,k} \exp(is(\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_k)), \qquad (4)$$

где \mathbf{r}_{j} — радиус-вектор *j*-й частицы. Для макроскопически изотропной системы выражение (4) может быть записано в виде [13]

$$S(s) = 1 + n \int_{V_0} (g(r) - 1) \frac{\sin sr}{sr} 4\pi r^2 dr + nF_0, \qquad (5)$$

где V_0 — объем системы, $n = N/V_0$ — плотность рассеивающих узлов, g(r) — радиальная корреляционная функция взаимного расположения частиц [13], она имеет смысл вероятности обнаружить центр шара на расстоянии r от центра данного шара; F_0 — формфактор рассеивающей системы объема V_0 . Вклад от последнего слагаемого является малым уже для $s > 2\pi/L$, где L — размер рассеивающего объема в направлении вектора рассеяния.

Исследуемый композитный материал является структурой с высокой концентрацией рассеивающих частиц; для таких систем сложный вид и зависимость от концентрации функции g(r) не позволяют аналитически решить обратную задачу нахождения распределения частиц по размерам из спектра РМУ. Анализ данных малоуглового рассеяния в таких системах проводят на основе моделирования рассеивающей структуры, а определение параметров распределения — с помощью сравнения модельного спектра с экспериментальным. Перкусом и Йевиком было предложено аналитическое приближение корреляционной функции g(r) для концентрированных систем сферических частиц [8], однако погрешность этого приближения растет с увеличением концентрации [9]. Альтернативным подходом, применимым для любых концентраций, является прямое численное моделирование малоуглового рассеяния, этот подход и использовался в данной работе.

В модели композитный материал представлялся как система сферических рассеивающих центров (металлических шаров), имеющих заданное распределение по размерам. Мы использовали так называемое "log-нормальное" распределение, характерное для широкого класса полидисперсных систем, в которых образование кластеров происходит за счет процессов самоорганизации [14]

$$D(\ln r) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\beta}} \exp\left[-\frac{(\ln r - \ln r_0)^2}{2\beta^2}\right],$$
 (6)

 r_0 и β являются параметрами такой расстановки, также параметром служит объемная концентрация шаров *с*. Шары, имеющие распределение по размерам (6), случайным образом расставлялись в заданном объеме $L_x \times L_y \times L_z$ так, чтобы они не перекрывались. Величины r_0 , β использовались в дальнейшем как подгоночные параметры при сопоставлении результатов моделирования с экспериментальной кривой, однако в действительности достаточно произвести подгонку по параметру β в безразмерных координатах *sr*, а затем найти r_0 масштабированием спектра.

Непосредственное вычисление радиальной корреляционной функции g(r) связано с вычислительными трудностями и требует большого числа усреднений, так как даже малые флуктуации корреляционной функции g(r)для больших r существенно влияют на величину структурного фактора из-за быстрого роста множителя r^2 в подынтегральном выражении (5). Это приводит к большим ошибкам в определении структурного фактора для малых *s*. Менее трудоемким является прямое вычисление амплитуды и полной интенсивности рассеяния

$$A = \sum_{j=1}^{N} f_j \exp(i\mathbf{s}\mathbf{r}_j),$$
$$I(s) = |A(s)|^2.$$
(7)

Размер параллелепипеда, в котором расставлялись шары, составлял $2500r_0 \times 20r_0 \times 20r_0$, длинная сторона ориентировалась вдоль вектора рассеяния. Такое соотношение размеров позволило исключить влияние рассеяния от объема в целом ("нулевого пика", отвечающего последнему слагаемому в (5)) в представляющей интерес области векторов рассеяния. При объемной концентрации около 30 vol.% и таком размере параллелепипеда число шаров составляло ~ 50 000. Кроме того, полученные спектры рассеяния некогерентно усреднялись по 500 случайным реализациям.

3. Обсуждение результатов

Перед тем как проводить подгонку экспериментального спектра РМУ, необходимо уяснить влияние таких параметров структуры, как объемная концентрация c и дисперсия β , на форму этого спектра. Это позволит оценить точность, с которой эти параметры могут быть определены в результате подгонки.

Рис. 3 иллюстрирует влияние интерференционных эффектов на форму спектра РМУ. Штриховой линией на этом рисунке показан формфактор отдельного шара; в пределе малых концентраций спектр РМУ будет с ним совпадать. Видно, что с ростом концентрации шаров на спектре появляются интерференционный провал в области малых углов и максимум, сдвигающийся в сторону увеличения *s*. Положение этого максимума отвечает среднему расстоянию между центрами шаров в системе. Все спектры на рис. 3 рассчитаны для монодисперсной системы.



Рис. 3. Расчетные спектры РМУ для различных концентраций металлической фазы (для монодисперской системы).



Рис. 4. Расчетные спектры РМУ для различных параметров *β*. На вставке — соответствующие распределения по радиусам.

На рис. 4 показана зависимость формы спектра рассеяния от величины дисперсии β . Для удобства сопоставления все спектры выбором r_0 сдвинуты так, чтобы положение их максимумов совпадало с положением максимума на экспериментальной кривой. Сами распределения по размерам приведены на вставке.

При подгонке экспериментального спектра РМУ использовалось известное значение объемной концентрации *с*. Процедура подгонки выглядела следующим образом: сначала при некотором фиксированном r'_0 определялось значение β , дающее наилучшее совпадение формы экспериментального и расчетного спектров в безразмерных координатах sr_0 , максимум этой кривой обозначим $s_{\text{max}}r'_0$. После этого по положению максимума на экспериментальной кривой $s^{\text{ехр}}_{\text{max}}$ определялось $r_0 = r'_0 s_{\text{max}}/s^{\text{ехр}}_{\text{max}}$. Результаты подгонки показаны на рис. 2 сплошной линией; полученные в результате этой подгонки параметры распределения гранул по размерам

в реальной структуре составили $r_0 = 1.4$ nm, $\beta = 0.2$. Соответствующее распределение по радиусам приведено на вставке к рис. 2. Как видно из рисунка, результаты расчетов совпадают с экспериментальным спектром с очень хорошей точностью, что указывает на адекватность использования в модели "log-нормального" распределения по размерам.

Заметим, что, как видно из рис. 4, форма спектра РМУ весьма чувствительна к изменению параметра β , что позволяет определить его значение из подгонки с большой степенью точности. Заметное отличие расчетного спектра РМУ от экспериментального наблюдалось при отклонении β от оптимального уже на $\Delta\beta = 0.025$. Погрешность в определении $r_0 \Delta r$ определяется погрешностью определения положения максимума на экспериментальном спектре РМУ $\Delta s: \Delta r/r_0 \sim \Delta s/s_{max}$. В нашем эксперименте разрешение по вектору рассеяния Δs составляло 0.1 nm⁻¹, что соответствует $\Delta r/r \simeq 10\%$.

Средний радиус гранул отличается от r_0 из-за асимметрии распределения и составляет

$$\bar{r} = \frac{\int_0^\infty r \exp\left(-(\ln r - \ln r_0)^2 / 2\beta^2\right) dr}{\int_0^\infty \exp\left(-(\ln r - \ln r_0)^2 / 2\beta^2\right) dr} \simeq 1.5 \,\mathrm{nm.}$$
(8)

Это значение хорошо согласуется с данными ПЭМ.

Таким образом, в данной работе изучались спектры малоуглового рентгеновского рассеяния в композитном материале Cu: SiO₂, полученном методом одновременного магнетронного напыления. Объемная концентрация Си в материале составляла 28 vol.%, при таких концентрациях интерференционные эффекты играют ключевую роль в формировании спектров РМУ. С помощью прямого численного моделирования интенсивности рассеяния были получены параметры распределения гранул Си по размерам. В модельном расчете предполагалось, что гранулы имеют "log-нормальное" распределение по размерам, при этом было получено очень хорошее согласие результатов расчета с экспериментом. Это позволяет утверждать, что такой вид распределения по размерам хорошо применим для подобных материалов. Высокая чувствительность формы спектра РМУ к изменению параметров распределения позволила определить значения этих параметров в композитном материале Cu: SiO2 с высокой степенью точности: $r_0 = 1.4 \pm 0.1 \,\mathrm{nm}$, $\beta = 0.200 \pm 0.025$. Полученное в результате подгонки значение среднего радиуса гранул $r \simeq 1.5\,\mathrm{nm}$ хорошо согласуется с данными ПЭМ. Следует отметить, что данные о детальном виде распределения по размерам другими способами ранее получить не удавалось.

Список литературы

- [1] B. Abeles, P. Sheng, M.D. Coutts, Y. Arie. Phys. 24, 407 (1975).
- [2] D.V. Averin, K.K. Likharen. Mesoscopic Phenomena in Solids / Ed. B. Al'tschuler, P. Lee and R. Webb. Elsevier, Amsterdam (1991). P. 169.

- [3] S.V. Vyshenski. Письма в ЖЭТФ 61, 111 (1996).
- [4] И.М. Лифшиц, В.В. Слезов. ЖЭТФ 35, 479 (1958).
- [5] Д.А. Закгейм, И.В. Рожанский, И.П. Смирнова, С.А. Гуревич. ЖЭТФ 91, 553 (2000).
- [6] Д.И. Свергун, Л.А. Фейтин. Рентгеновское и нейтронное малоугловое рассеяние. Наука, М. (1986). 280 с.
- [7] J.H. Letscher, P.W. Schmidt. J. Appl. Phys. 37, 649 (1966).
- [8] J.K. Percus, G.J. Yevick. Phys. Rev. 110, 1 (1958).
- [9] D. Frenkel, R.J. Vos, C.G. de Kruif, A. Vrij. J. Chem. Phys. 84, 4625 (1986).
- [10] С.А. Гуревич, А.И. Екимов, И.А. Кудрявцев, Н.А. Берт, М.В. Ватник, О.Г. Люблинская, А.В. Осинский, Н.Н. Фалеев. ФТП 26, 102 (1992).
- [11] Т.Н. Василевская, С.Г. Ястребов, Н.С. Андреев, И.А. Дроздова, Т.К. Звонарева, В.Н. Филипович. ФТТ 41, 2088 (1999).
- [12] F. Zernike, J.A. Prinz. Z. Phys. 41, 184 (1927).
- [13] Дж. Займан. Модели беспорядка. Мир, М. (1982). 592 с.
- [14] C.G. Granqvist, R.A. Buhrman. J. Appl. Phys. 47, 2200 (1976).